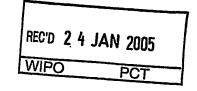
DEST AVAILABLE COPY





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ______ 0 5 NOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.2) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 25 bls, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

Réservé à l'INPI	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 W / 210502		
REMISE DES PIECES DATE 4 NOV 2003 JEU 75 INPI PARIS 34 SP Nº D'ENREGISTREMENT 0312934 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI Vos références pour ce dossier (facultuty) BIF116037/FR/EP	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE SANTARELLI 14, avenue de la Grande Armée 75017 PARIS		
Confirmation d'un dépôt par télécopie	□ N° attribué par l'INPI à la télécopie		
NATURE DE LA DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes		
Demande de brevet			
Demande de certificat d'utilité			
Demande divisionnaire			
Demande de brevet initiale	N° Date		
ou demande de certificat d'utilité initiale	N° Date L: L		
Transformation d'une demande de.			
brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou	N° Date		
DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N°		
	S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	Personne morale Personne physique		
Nom ou dénomination sociale	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		
Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF	Etablissement public à caractère scientifique, technique et industriel		
Domicile Rue	31/33, rue de la Fédération,		
ou Code postal et ville	17.5.7.5.2 PARIS CEDEX 15		
Pays	FRANCE		
Nationalité	FRANCAISE No de télégorie Grantetie		
N° de téléphone (facultatif)	N° de télécopie i facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)	S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		



EMISE DES PIÈCES

Reservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



4 NOV 2						
75 INPI PAR		.				
ATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	0312934	·		DB 540 W / 210502		
MANDATAIRE (s'il y a	lieu)	BIF116037/FR	/EP			
Nom						
Prénom						
Cabinet ou Société	Cabinet ou Société					
		SANTARELL	I			
N ode pouvoir permande lien contractuel	ent et/ou					
Pug		14 Avenue de la Grande Armée				
Rue						
Adresse Code (oostal et ville	[7 5 0 1 7	PARIS			
Pays		FRANCE				
N° de téléphone (facul		01 40 55 43 43				
N° de télécopie ¿faculta	N° de télécopie (facultatif)		**			
Adresse électronique ¿	facultatif)					
INVENTEUR (S) Les in		Les inventeurs s	ont nécessairement des	personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		☐ Oui ☑ Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)				
RAPPORT DE RECHERCHE Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transfo				t (y compris division et transformation)		
Éta	blissement immédiat établissement différé	M				
Paiement échelonné de la redevance (en deux revsements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non				
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG				
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AWINÉS		☐ Cochez la case si la description contient une liste de séquences				
Le support électroniqu	e de données est joint					
La déclaration de con séquences sur suppo support électronique o	ort papier avec le					
Si vous avez utilisé indiquez le nombre						
SIGNATURE DU DEI OU DU MANDATAIR (Nom et qualité du	E B	runo QUANTIN	1 / 92.1206 MARELLI	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		
.				M. MARTIN		

Le domaine général de l'invention est celui de la production de courants d'ions multichargés à partir d'un plasma confiné, telle que dans une source d'ions RCE ou dans une machine à plasma. L'invention concerne plus particulièrement un dispositif destiné à contrôler la température électronique dans un plasma RCE.

La fonction des sources d'ions à Résonance Cyclotron des Electrons (« RCE », ou « *ECR* » en anglais) est de produire, d'une part, des intensités ioniques allant du μA au mA, et d'autre part une gamme d'états de charge étendue. Les utilisateurs de ces sources demandent actuellement plusieurs mA d'ions de faible charge électrique, comme B¹⁺ à B³⁺ (servant d'implanteurs), environ 1 mA d'ions moyennement chargés, comme Ar^{8+} , Ar^{12+} ou Pb^{27+} (alimentant des accélérateurs pour la physique nucléaire), et quelques μA d'ions ayant des charges très élevées, comme Ar^{16+} , Ar^{17+} ou Ar^{18+} (alimentant des accélérateurs pour la physique nucléaire ou la physique atomique).

La fonction des machines à plasma RCE est de produire des ions qui ne sont pas extraits de la machine. Ces ions sont par exemple utilisés pour faire des dépôts de matériaux sur des substrats.

15

20

25

30

Un plasma RCE (ensemble d'ions et d'électrons) est confiné dans une enceinte plongée dans une configuration magnétique résultant de la superposition de deux champs magnétique, l'un axial et l'autre radial, dans le but d'éviter les fuites du plasma. Tous les électrons du plasma oscillent sur des lignes de champ magnétique qui sont facilement calculables par différent codes (voir par exemple l'article de A. Girard et al. intitulé « Electron Cyclotron Resonance Ion Sources: Experiments and Theory », Actes du 12ème Séminaire International sur les sources d'Ions ECR, 25-27 avril 1995, Riken, Japon).

Pour produire des ions de charge q+, un plasma RCE utilise le principe de « l'épluchage » répété des atomes qui résulte des collisions entre ces atomes et des électrons énergétiques. On estime empiriquement que l'énergie requise pour ces électrons doit être égale à environ 3 fois le potentiel d'ionisation de l'ion $X^{(q-1)+}$. Ainsi, le potentiel d'ionisation des atomes d'argon étant de 16 eV, l'énergie électronique optimale pour produire des ions Ar^+ est d'environ

100 eV; pour produire des ions Ar^{8+} , il faut des électrons ayant une énergie voisine de 500 eV, alors que pour obtenir des ions Ar^{18+} , les électrons doivent avoir une énergie de l'ordre de 15 keV.

Les intensités ioniques requises par les utilisateurs étant toujours croissantes, il est nécessaire de perfectionner les sources d'ions RCE. Plusieurs voies ont été explorées dans ce but :

- augmentation de la fréquence de chauffage des électrons : on augmente de la sorte la densité des électrons du plasma, selon une loi bien connue en physique des plasmas ;
- optimisation du confinement des électrons et des ions du plasma :
 beaucoup de travaux ont été réalisés, voir par exemple l'article de S. Gammino et
 al. intitulé « Operation of the Serse superconducting ECR ion source at 28 GHz »
 (Review of Scientific Instruments, vol. 72, n° 11, p. 4090, novembre 2001) ; dans
 cet article sont exposées des lois d'échelles liées au confinement du plasma ;
 - optimisation de l'injection de micro-ondes : voir par exemple le brevet FR 2 681 186 ; et

15

20

25

30

- diminution de la température des ions par injection d'un gaz plus léger que le gaz à ioniser (technique du mélange de gaz) : voir l'article de A. Drentje intitulé « *Techniques to improve highly charged ions output from ECRISs* » (Actes du 15ème Séminaire International sur les sources d'Ions ECR, Université de Jyväskylä, Finlande, juin 2002).

Des mesures de température électronique T_e ont été effectuées. Il a été montré (voir par exemple l'article de A. Girard *et al.* cité ci-dessus) que, dans un plasma RCE, il existe à la fois une population d'électrons « très chauds » ($T_e > 50 \text{ keV}$), une population d'électrons « chauds » ($1 \text{ keV} < T_e < 50 \text{ keV}$) et une population d'électrons « froids » ($T_e < 1 \text{ keV}$). En fait, seuls les électrons chauds ayant une température inférieure à 20 keV sont utiles dans un plasma RCE (par exemple, pour obtenir des ions Ar^{18+} , il faut, comme indiqué ci-dessus, des électrons de 15 keV environ). Or l'on trouve couramment, dans un plasma RCE, des électrons d'énergie supérieure à 100 keV : ces électrons sont tout à fait inefficaces du fait de leur énergie excessivement supérieure à l'énergie optimale.

L'invention propose donc un dispositif pour contrôler la température électronique dans une chambre à plasma, ledit dispositif étant remarquable en ce qu'il comprend au moins un limiteur placé sur la trajectoire d'électrons dont l'énergie est supérieure à une énergie prédéterminée, de façon à former obstacle à ces électrons.

5

10

15

25

30

Ainsi, selon leurs positions dans la chambre à plasma, ces limiteurs vont stopper les électrons plus ou moins énergétiques. Le procédé selon l'invention permet ainsi de réduire le nombre des électrons jugés trop chauds, voire de les supprimer complètement, en plaçant des obstacles sur leur parcours.

Grâce à l'invention, on peut contrôler la température électronique de manière à ce qu'elle coïncide avec les potentiels d'ionisation des ions concernés. En outre, lorsque les ions ou les électrons du plasma viennent toucher les limiteurs, il se crée des électrons secondaires de basse énergie (quelques eV); ces électrons seront alors immédiatement chauffés et contribueront avantageusement au processus d'ionisation.

Selon des caractéristiques particulières de l'invention, la position et le nombre desdits limiteurs sont choisis en fonction de l'énergie des électrons et du nombre d'électrons auxquels l'on veut faire obstacle.

Grâce à ces dispositions, on peut sélectivement supprimer les ... 20 électrons indésirables.

Selon d'autres caractéristiques particulières de l'invention, la forme de chaque limiteur est choisie en fonction de la configuration des trajectoires électroniques dans ladite chambre à plasma.

Grâce à ces dispositions, on peut, en couvrant avec les limiteurs selon l'invention une zone plus ou moins large dans la chambre à plasma, déterminer la plage d'énergie des électrons auxquels il est fait obstacle.

Selon encore d'autres caractéristiques particulières de l'invention, les matières constituant ces limiteurs sont choisies en fonction de leur aptitude à produire des électrons secondaires lorsqu'elles sont soumises à des collisions avec des électrons de haute énergie.

En effet, selon les matières utilisées pour ces limiteurs, le nombre et l'énergie des électrons secondaires ainsi produits peuvent être plus ou moins

importants. On peut donc ainsi doser l'effet de ces électrons secondaires sur la production d'ions.

L'invention vise également une source d'ions RCE et une machine à plasma RCE comprenant, avantageusement, l'un quelconque des dispositifs décrits succinctement ci-dessus.

D'autres aspects et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée, que l'on trouvera ci-dessous, de modes particuliers de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs. Cette description se réfère aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe d'une chambre à plasma, dans le cas d'un confinement radial hexapolaire,
 - les figures 2a et 2b sont des vues en coupe d'une chambre à plasma équipée d'un limiteur selon l'invention placé dans une zone sans plasma de la chambre, avec deux formes différentes de limiteurs,
- la figure 3 est une vue en coupe d'une chambre à plasma équipée d'un limiteur selon l'invention placé dans une zone de fuite du plasma,
 - la figure 4 est une vue en coupe d'une chambre à plasma équipée d'un limiteur selon l'invention placé dans la zone à plasma chaud de la chambre,
- la figure 5 représente un exemple de structure pour un limiteur selon l'invention, et
 - la figure 6 est une vue en perspective d'une chambre à plasma équipée de limiteurs selon la figure 5.

On va décrire à présent divers modes de réalisation de 25 l'invention.

Comme indiqué ci-dessus, le profil magnétique d'une source RCE est donné par la superposition de deux champs magnétiques (axial et radial). La zone où oscillent les électrons a une forme d'étoile à trois branches si le champ magnétique radial est constitué par un hexapôle. Plus généralement, la zone dans laquelle circulent les électrons a une forme d'étoile à n branches lorsque le champ magnétique radial est constitué de 2n pôles. Par exemple, la

30

figure 1 est une vue en coupe d'une chambre à plasma 1, dans le cas d'un confinement radial obtenu au moyen de six pôles magnétiques 2a à 2f.

On distingue, en particulier, trois types de zones dans la chambre à plasma 1 :

- une zone centrale 3 du plasma (comprenant essentiellement des électrons « chauds » et des ions « froids »),
 - des zones de fuite 4 du plasma, et
 - des zones sans plasma 5.

5

20

25

30

Il est à noter que l'on peut trouver des électrons très chauds dans 10 toutes ces zones, y compris dans les zones sans plasma 5.

Les figures 2a et 2b sont des vues en coupe d'une chambre à plasma 1 équipée d'un limiteur 100 placé dans une zone sans plasma 5 de la chambre, avec deux formes différentes de limiteurs. La forme relativement plus large du limiteur de la figure 2b permet d'intercepter des électrons sur un nombre supérieur de trajectoires.

La **figure 3** est une vue en coupe d'une chambre à plasma 1 équipée d'un limiteur 100 placé dans une zone de fuite 4 du plasma, et la **figure 4** est une vue en coupe d'une chambre à plasma 1 équipée d'un limiteur 100 interceptant la zone centrale 3 de la chambre.

On notera que, s'il est vrai que les électrons de haute énergie sont répartis dans toute la chambre à plasma 1, leur concentration est évidemment maximale dans la zone centrale 3, où les températures du plasma sont ellesmêmes maximales. Pour une efficacité maximale des limiteurs 100, on cherchera donc à les placer aussi près que possible de cette zone centrale 3, mais il faudra tenir compte, notamment, de la température pouvant être supportée par la structure du limiteur 100.

La figure 5 représente un exemple de structure pour un ensemble de limiteurs selon l'invention. Chaque limiteur 100 comprend ici une partie active 7 en forme de barreau cylindrique destiné à être placé radialement dans un plan transversal de la chambre à plasma 1. Une extrémité du barreau va pointer vers la zone centrale 3 de la chambre, cependant que l'autre extrémité

est fixée à une autre partie du limiteur 100 constituée par un anneau 6 destiné à encercler le plasma.

Selon un autre mode de réalisation (non représenté), la partie active 7 du limiteur 100 est fixée, aux fins de maintien mécanique, sur une partie intermédiaire qui est elle-même fixée sur un anneau 6 du type utilisé dans le mode de réalisation précédent. Par exemple, la partie intermédiaire peut être constituée d'une tige-support, et la partie active 7, qui peut avoir la forme d'un barreau ou d'un disque ou encore d'une bille, est montée au bout de cette tige-support.

L'épaisseur des anneaux 6 doit être suffisante pour assurer un maintien suffisamment rigide des parties actives, mais ne doit pas être trop grande, afin d'éviter de perturber le plasma. Par exemple, une épaisseur de 5 à $10~\mu A$ convient en général pour une chambre à plasma de 100~mm de diamètre.

10

15

20

25

L'homme du métier choisira des parties actives 7 de plus ou moins grande taille (par exemple le diamètre des barreaux de la figure 5) en fonction, en particulier, du taux de production d'électrons secondaires recherché lors de l'impact des électrons très chauds sur ces parties actives 7. Mais s'il constate qu'un nombre trop important d'électrons chauds sont présents, il augmentera la taille des parties actives 7 en conséquence.

On notera que, en fonctionnement, l'extrémité de la partie active 7 située au plus près de la zone centrale 3 du plasma s'érode à son contact, de sorte que sa forme en sera affectée. Par exemple, si la partie active 7 est constituée par un barreau dont l'extrémité est, au départ, plate, et si le plasma a, au niveau de cette extrémité, une forme concave, l'extrémité du barreau prendra en cours de fonctionnement une forme concave.

Les diverses parties constituant les limiteurs 100 peuvent être faites de diverses matières.

Les anneaux 6 doivent, évidemment, être faits de matières qui ne 30 risquent pas de fondre en cours de fonctionnement; de plus, ces matières doivent de préférence ne pas dégager de gaz. Ces anneaux 6 peuvent par

exemple être en métal ou en céramique (telle que l'alumine ou l'oxyde de zirconium).

Si l'on utilise des parties intermédiaires telles que des tiges-supports, celles-ci seront soumises aux même contraintes de matières que les anneaux 6.

5

10

15

20

Enfin les parties actives 7 doivent, de préférence, être aptes à supporter les hautes températures présentes dans le plasma (alors que les autres parties des limiteurs 100, qui sont destinées au support mécanique des parties actives 7, et sont, d'une part, plus éloignées des parties chaudes du plasma et d'autre part protégées dans une certaine mesure par ces parties actives 7, requièrent moins de précautions à cet égard). De préférence, les parties actives 7 seront en un matériau réfractaire, tel que le tungstène, le tantale ou le molybdène ; mais elles pourront également être en céramique (telle que l'alumine ou l'oxyde de zirconium ou l'oxyde de thorium), ou encore être entièrement métalliques.

Selon les matières choisies pour les limiteurs, le nombre et l'énergies des électrons secondaires produits lors de l'impact des électrons très chauds seront différents. L'homme du métier choisira donc les matières adaptées à ses besoins, après quelques test *in situ* si nécessaire.

La figure 6 est une vue en perspective d'une chambre à plasma 1 équipée d'un certain nombre de limiteurs 100. Les limiteurs ont ici une forme du type illustré sur la figure 5. Comme on le voit sur la figure 6, les barreaux 7 sont contenus dans des zones 8, 8', 8" où circulent des électrons indésirables.

REVENDICATIONS

- Dispositif pour contrôler la température électronique dans une
 chambre à plasma (1), caractérisé en ce qu'il comprend au moins un limiteur
 (100) placé sur la trajectoire d'électrons dont l'énergie est supérieure à une énergie prédéterminée, de façon à former obstacle à ces électrons.
 - 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la position et le nombre desdits limiteurs (100) sont choisis en fonction de l'énergie des électrons et du nombre d'électrons auxquels l'on veut faire obstacle.
 - 3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la forme de chaque limiteur (100) est choisie en fonction de la configuration des trajectoires électroniques dans ladite chambre à plasma (1).
 - 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les matières constituant ces limiteurs (100) sont choisies en fonction de leur aptitude à produire des électrons secondaires lorsqu'elles sont soumises à des collisions avec des électrons de haute énergie.
- 5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'au moins un limiteur (100) comprend des parties métalliques.
 - 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'au moins un limiteur (100) comprend des parties en céramique.
 - 7. Source d'ions RCE, caractérisée en ce qu'elle comprend un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.
 - 8. Machine à plasma RCE, caractérisée en ce qu'elle comprend un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

25

15

REVENDICATIONS

- 1. Dispositif pour contrôler la température électronique dans une 5 chambre à plasma (1), caractérisé en ce qu'il comprend au moins un limiteur (100) placé sur la trajectoire d'électrons dont l'énergie est supérieure à une énergie prédéterminée, de façon à former obstacle à ces électrons.
 - 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la position et le nombre desdits limiteurs (100) sont choisis en fonction de l'énergie des électrons et du nombre d'électrons auxquels l'on veut faire obstacle.

10

15

20

3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la forme de chaque limiteur (100) est choisie en fonction de la configuration des trajectoires électroniques dans ladite chambre à plasma (1) de manière à couvrir avec chaque limiteur (100) une zone de la chambre à plasma (1) correspondant à la plage d'énergie des électrons auxquels on veut faire obstacle.

::::

- 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les matières constituant ces limiteurs (100) sont choisies en fonction de leur aptitude à produire des électrons secondaires lorsqu'elles sont soumises à des collisions avec des électrons de haute énergie.
- 5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'au moins un limiteur (100) comprend des parties métalliques.
- 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, 25 caractérisé en ce qu'au moins un limiteur (100) comprend des parties en céramique.
 - 7. Source d'ions RCE, caractérisée en ce qu'elle comprend un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.
- 8. Machine à plasma RCE, caractérisée en ce qu'elle comprend un 30 dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

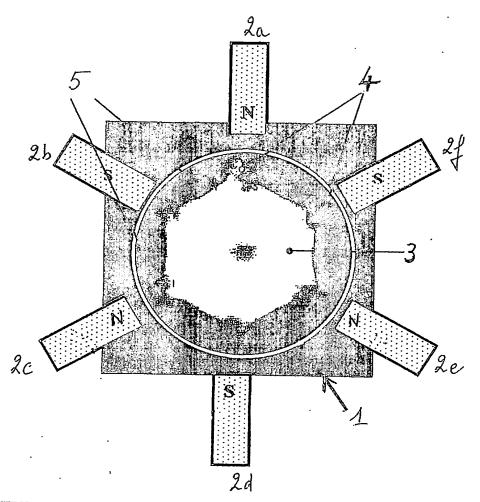
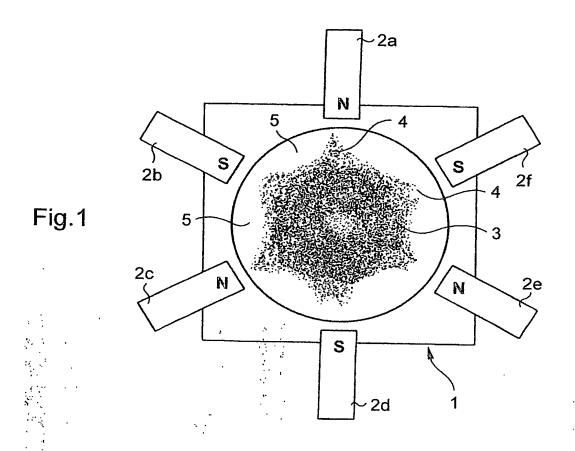
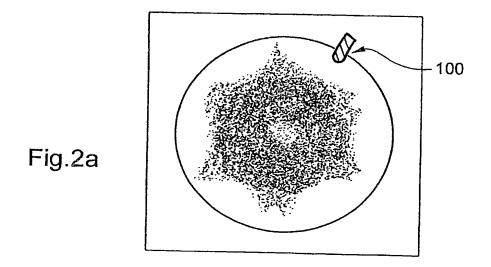


FIGURE 1





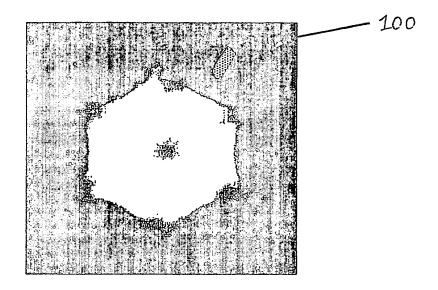


FIGURE 2a

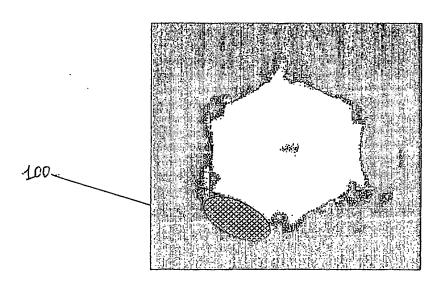
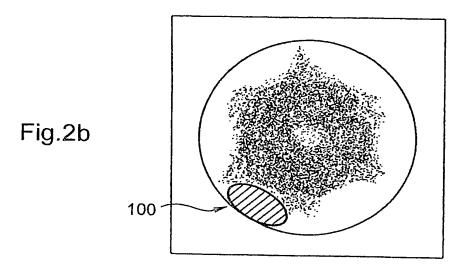
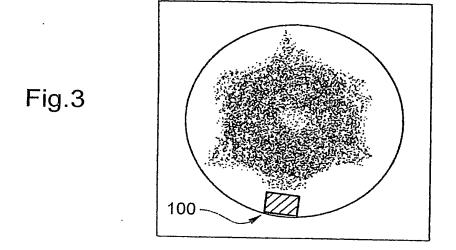
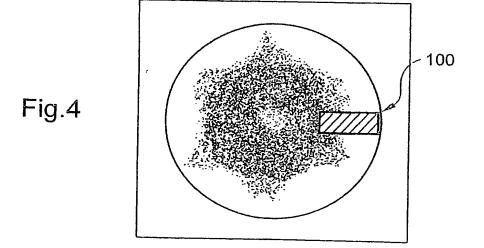


FIGURE 2 b







野田湖の大

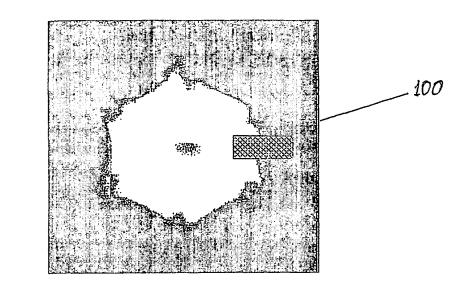
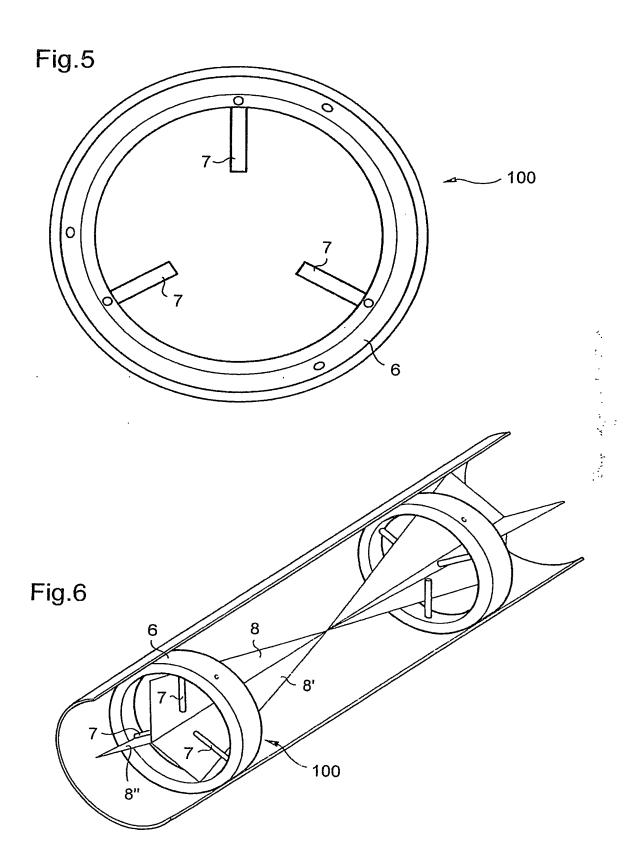
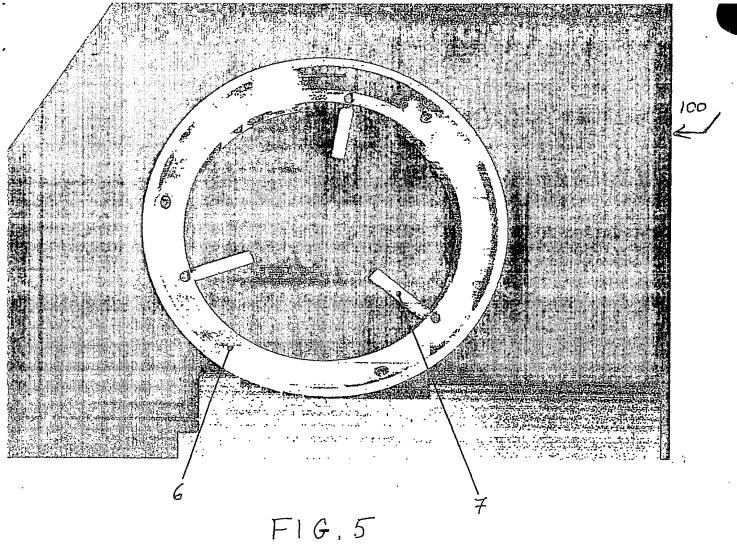


FIG. 3 100

F16.4





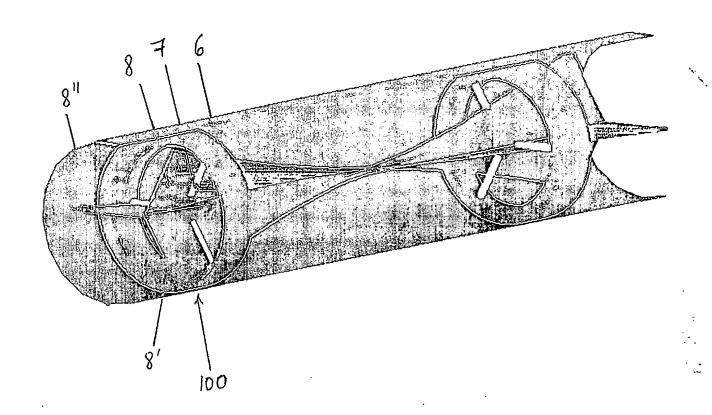
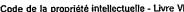


FIG. 6



EDRECHEL EN COUNTLOUGO

CERTIFICAT D'UTILITE





Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg '5800 Paris Cedex 08

féléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1./1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W / 270601 Vos références pour ce dossier (facultatif) BJF116037/FR N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dispositif pour contrôler la température électronique dans un plasma RCE. LE(S) DEMANDEUR(S): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S): HITZ 30 Nom Prénoms Denis 5, avenue du Grand Châtelet Rue Adresse Code postal et ville PARIS, France 13:8:11:0:01 Société d'appartenance (facultatif) 2 Nom CORMIER Prénoms David 16, rue Saint Amable Rue Adresse. Code postal et ville 16 13 12 10 10 RIOM, France Société d'appartenance (facultatif) গ্র Nom Prénoms Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. DATE ET SIGNATURE(S) **DU (DES) DEWANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE** Le 4 Novembre 2003 (Nom et qualité du signataire) Bruno QUANTIN Nº 92.1206 SANTARELI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.